

プロジェクトレビュー _{日米科学技術協力事業} PHENIX 計画 - 6年間の成果と次期計画 -

3. タスク2 中性子照射タングステンの熱・強度特性

3. Task 2: Thermal and Mechanical Properties of Neutron Irradiated Tungsten

檜木達也¹⁾,長谷川 晃²⁾,宮澤 健²⁾,秋吉優史³⁾,近藤創介^{1,2)}

HINOKI Tatsuya¹⁾, HASEGAWA Akira²⁾, MIYAZAWA Takeshi²⁾, AKIYOSHI Masafumi³⁾

and KONDO Sosuke^{1, 2)}

1)京都大学,2)東北大学,3)大阪府立大学

(原稿受付:2020年1月7日)

オークリッジ国立研究所 (ORNL)の研究炉 High Flux Isotope Reactor (HFIR) において,各種タングステン系 材料の550℃~1050℃での中性子照射試験を行った.核融合環境に近い中性子スペクトルを得るために,熱中性子 遮蔽を行った照射試験も実施し,基本的な強度特性,熱特性に関する中性子照射効果に関する知見を得た.国内 で開発された K-doped W,W-3%Re 等の新規材料が広範囲の条件で照射後も高い延性挙動を示すことを見出した.

Keywords:

neutron irradiation, tungsten, thermal neutron shielding, transmutation, thermal properties, mechanical properties

3.1 諸言

PHENIX 計画の目的の一つは、タングステン系材料の各 種特性に及ぼす中性子照射効果を明らかにすることであ る.しかしながらタングステンの場合,熱中性子によるレ ニウム (Re)の生成等核変換の効果が大きく、特に比較的 高い損傷量での中性子照射において影響が顕著となる.核 変換効果を考慮した比較的高い線量領域でのタングステン の照射効果はこれまで得られていない. また, これまでに 得られているタングステン系材料の中性子照射データ は,800℃程度までが中心であるが、ダイバータでは、最高 1500℃程度までの温度が想定されている。純タングステン では、1000℃以上で再結晶が生じるが、1000℃以上での中 性子照射データは非常に限られている.本研究では、タン グステンの核変換効果を抑制するための熱中性子遮蔽を行 い,1000℃を超える照射温度も含めて,中性子照射を現状 候補とされる各種タングステン系材料に対して行うことに より,核融合ダイバータ用タングステン系材料に対する中 性子照射効果の基本的な理解をめざした.また,熱中性子 遮蔽の無い通常のカプセルでの中性子照射も行い、核変換 効果の評価も行った.

3.2 中性子照射タングステン系材料

材料の中性子照射効果を調べるには照射前の材料中の組 織が単純でクリアーである方が理解しやすい.一方でタン グステンの場合,核融合炉への適用を考えると,室温近傍 における粒界脆化や再結晶脆化の起こりにくい材料の開発 が喫緊の課題となっている.タングステンの脆性抑制には これまでに合金化や加工熱処理による粒界や粒内組織の調

Kyoto University, Uji, KYOTO 611-0011, Japan

整が行われてきた. 現時点では工業的背景やコスト, 均質 性・再現性などを勘案すると、国際熱核融合実験炉 ITER のダイバータタイルの製造に用いられている粉末焼結と高 温における圧延加工によって作られたタングステンの厚板 材料における中性子照射効果を調べることが核融合炉用タ ングステンの開発に寄与すると考えた. そこで日本側の試 料としては、微細粒組織で低温での靭性改善が見込まれる いくつかのタングステン系材料について,合金原料素材, 熱処理、圧延加工率などをそろえるために、アライドマテ リアル社に依頼して,純タングステン (pure W),カリウ ム添加タングステン (K-doped W), タングステン-3%レ ニウム合金 (W-3%Re),およびカリウムとレニウムを複合 添加した合金(K-doped W-3%Re)の4つの材料を照射用 試料として作製した. 靭性改善が見込まれる微細結晶粒組 織とするために、高温における圧延時の加工率を80%にそ ろえ、最終熱処理として900℃・20分の応力除去処理を 行った厚板から放電加工により各試験片を切り出し、表面 研磨仕上げをしたものを日本側の共通試料とした. これら の試料は、2011(平成23)年度から2014(平成26)年度までの 核融合科学研究所 LHD 計画共同研究(核融合炉の中性子 照射環境に対応した高熱流束機器用タングステン材料の開 発と製造:研究代表者・長谷川晃)においてある程度まと まった量を作製したものから選択した.米国側は、学術的 にタングステンそのものの照射脆化機構を明らかにするこ とを目的として単結晶タングステンと、さらにいくつかの 市販のタングステンおよびタングステンーレニウム合金な どを試料として照射に供した.

日本側の試料については、中性子照射の準備と並行して

corresponding author's e-mail: hinoki@iae.kyoto-u.ac.jp

非照射材の引張試験やシャルピー衝撃試験による機械的特 性の評価と、最高2300℃までの熱処理による組織変化、熱 伝導率などのデータの取得を進めた. また HFIR での熱中 性子遮へい及び温度モニター付き照射カプセルを用いた RB*照射(詳細は次節)が始まり、おおよその照射温度が 判明した段階で,照射時間と同じ期間・同じ温度に保持し た熱時効試験も開始した.RB*照射は4サイクル (28×4=112日),約2700時間行ったので,熱時効試験は 800℃と1100℃で3000時間まで実施し、各温度における微 細組織安定性の基礎データを収集し、作製したタングステ ン系材料の高温環境下での微細組織の安定性[1]のデータ を取得した.各試料の照射前における組織の異方性の機械 特性への影響[2],熱伝導特性[3]および強度や温度を下げ たときに延性が急激に低下する境界温度である延性脆性遷 移温度 (Ductile Brittle Transition Temperature: DBTT) な どの機械特性[4]のデータも、照射後試験の開始に合わせ て収集し、データベース化に備えた.

3.3 熱中性子遮蔽効果

米国のオークリッジ国立研究所(ORNL)にある High Flux Isotope Reactor (HFIR) において,上述の各種タング ステン系材料に対して中性子照射試験を行った. ガドリニ ウムにより熱中性子遮蔽を行った RB*カプセルでは、約 550℃,約850℃,約1050℃で0.2~0.7 dpa (displacement per atom) 程度の照射を行った.熱中性子遮蔽無しで 50×6mm 径程度の容積を持つ比較的小型の Rabbit カプセ ルを用いた中性子照射も,800℃,1100℃で0.4~0.5 dpa 程度まで照射を行った.強度や熱拡散等の基本的物性,耐 熱負荷特性、トリチウム透過等多様な特性を系統的に評価 できるように、日米で550℃の温度領域で406個,850℃の温 度領域で389個, 1050℃の温度領域で359個の試料を RB* で照射した.図1の(a)はグラファイトでできたサブカプ セルであり、試料の形状に合わせたスロットが彫られてお り、(b)に示すような試料がスロットに装填された. RB* カプセルは(c)に示すように4つのサブカプセルが連結し 構成された. Rabbit 照射では, 800℃, 1100℃のカプセルで それぞれ27個の試料が照射された.



Rabbit 照射試料では微細組織に顕著な核変換効果が認

 図1 RB*照射カプセルと照射試料(a)グラファイト製サブカプ セル(b)RB*照射試料の一部(c)RB*照射カプセル.

められた.図2は単結晶タングステンの例であるが,オス ミウムやレニウムが局所的に濃化している.核変換"固体" 原子が及ぼす母相の転位ループやボイド組織発達への影響 の程度は必ずしも明確でないが,少なくとも高温では照射 中に比較的容易に拡散したことを示している.弾き出しに よる1次,2次欠陥と頻繁に対面し得るこれら異種元素の 生成の抑制が,実環境での材料挙動理解に不可欠であると 直感的に理解できる.

3.4 中性子照射タングステン系材料の熱特性

固体材料中の熱伝導は、大きく分けてフォノンによる フォノン伝導と、自由電子による電子伝導とに分けること が出来る.セラミックス材料は主に前者により熱を輸送 し、欠陥の導入に伴うフォノン-格子散乱や、温度上昇に伴 うフォノンーフォノン散乱の増加によって熱拡散率が低下 する.タングステン材料は、主に電子伝導により熱輸送を 行うが、1/3 程度はフォノン伝導によっても熱を輸送して おり、欠陥導入によって熱拡散率が低下する.さらに、タ ングステンが中性子照射により核変換することで生じるレ ニウムやオスミウムにより熱拡散率に大きな影響を及ぼす ことが知られている[5].PHENIX プロジェクトに於いて は、ガドリニウムによる熱中性子遮蔽を施した照射を行っ ており、核変換量を抑制した条件での欠陥導入により熱拡

ここでは、試料として Pure W 及び K-doped W-3%Re の ϕ 6 mm×t2 mmの円板で、平面に対して配向方向が平行 のものと垂直のものにそれぞれ照射した結果を報告する. ORNL の LAMDA 実験室内に設置された NETZSCH 社製 LFA-457を用いて約550℃で中性子照射した試料に対し て、100℃~500℃の範囲で熱拡散率測定し、 $\alpha = a/T^n + c$ という定数項を持つ関数を用いてフィッティングを行った [6].

RB*で約550℃で照射した材料と非照射材の測定結果を 図3に示す.照射後の試料はいずれも室温付近では照射前 と比べて明確な熱拡散率低下を示しているが500℃程度で 漸近しており,その差は小さくなっている.これは照射に よる格子欠陥導入によりフォノンが散乱され,低温時では 差異が大きかったが,高温ではフォノン-フォノン散乱に



図 2 1100[℃] で Rabbit 照射した単結晶タングステンの微細組織 と STEM-EDS による元素分析結果.



図3 照射前後のタングステン系材料の熱拡散率温度依存性.

より未照射試料に於いてもフォノン伝導の寄与は小さく電 子伝導が支配的になっているためと考えられる.高温での 未照射試料からの熱拡散率の低下がレニウムの寄与を表す と考えられるが,500℃までの測定に於いてはPure W 照射 後試料と未照射のW-3%Re試料とは後者の方が明らかに小 さい値を示している.核変換によるレニウムの生成量は少 なくとも3%以下であり,ガドリニウムシールドの効果が 確認されたと考えられる.今後,照射後の試料に対して高 温での電気伝導度測定を行うことで,熱拡散率の挙動を解 釈する手がかりになると考えられる.なお,K-doped W-3% Re 試料は,結晶粒配向方向で差が見られるが,これは照射 温度などの照射条件の差によるものであると考えられる.

3.5 中性子照射タングステン系材料の強度特性

熱中性子遮蔽を行った RB*カプセルにて550℃と850℃ で中性子照射した後の室温におけるビッカース硬さ測定に よる照射硬化量を各合金別にまとめた結果を図4に示す [7]. ここで SR は応力除去処理材を示し, R は再結晶材を 示している.純タングステンではR材の方がSR材よりも照 射硬化量がどちらの照射温度においても大きくなってい る.一方で,照射温度による照射硬化量の違いは純タング ステンではほとんど見られなかったのが特徴的である.

これまでに得られている純タングステンの原子炉照射に よる照射硬化量の照射量依存性をプロットしたのが図5



図 4 RB*で 550℃ および 850℃ でそれぞれ 0.4 dpa および 0.7 dpa 照射したタングステン材料のビッカース硬さ測定 による照射硬化量[7].

[7]である.今回の照射による照射硬化量は従来の研究に よるデータの傾向とほぼ一致していることがわかる.タン グステンの中性子照射では核変換により生成するレニウム が析出し始めると照射硬化量が急激に大きくなることが報 告されているが、今回の照射では熱中性子遮蔽をしている ことと、それらの違いがはっきりと出てくる約1 dpa より も若干照射量が少なかったことが原因ではないかと考えら れるが、透過電子顕微鏡などによる微細組織観察を行うこ とで、その機構が明らかになると期待される.

純タングステン以外の合金試料では、図4に示すように いずれも照射温度が高い方が、硬化量が大きくなり、純タ ングステンとは異なる硬化挙動を示している.またレニウ ムを3%添加した試料の方が、レニウムを含まない試料よ りも硬さが大きくなっている.レニウムを最初から含有し ていることで、照射量が1dpa以下でもW-Reの析出物が形 成し、硬化量が大きくなった可能性などが考えられるが、 その詳細は今後の微細組織観察によって調べる.

図6および図7は550℃と850℃で照射した各材料のSR 材の照射前後の引張試験で得られた応力ひずみ線図であ る.引張試験温度はいずれも原子炉照射温度よりも低い温 度で行った.その理由は照射によって生成した照射欠陥集 合体が,試験前および試験中の加熱によって変質すること を防ぐためである.非照射の状態では,強度や伸びの試験 温度依存性は小さいため,500℃でも700℃でもほぼ同じよ うな応力ひずみ線図となっている.3%のレニウムの添加 により,若干伸びが大きくなる傾向は見られるがその差は それほど顕著では無い.

照射後の応力ひずみ曲線は図6でも図7でも各試料とも 非照射材と大きく異なり,試料ごとの違いも顕著に表れて いる.550℃の照射ではいずれの試料も降伏応力あるいは 破壊応力が非照射材の2倍近くまで大きくなるというはっ きりとした照射硬化が見られた.一方で pure W ではほと んど塑性変形を伴わずに脆性的に破断したのに対し, W-3%Re および K-doped W-3%Re では非照射材の半分程度 ではあるが,伸びを示しているのが特徴である.



図5 これまでに得られた純タングステンの中性子照射量と照射 硬化の関係[7].



図 6 応力除去処理材の非照射試料,および 550℃ で 0.4 dpa 照射した後の試料を500℃で引張試験をした際の応力ひずみ線図[7].



Nominal strain, mm/mm

図7 応力除去処理材の非照射試料,および850℃で0.7 dpa 照射した後の試料を700℃で引張試験をした際の応力ひずみ線図[7].

850℃での照射でも同じように降伏応力が2倍程度にな るという傾向は同じであった.さらに pure W 以外の試料 では破断伸びが照射前とほぼ変わらない値を示しており, 照射後に破壊までに要するエネルギー,すなわち靭性値が 2倍程度になるという照射誘起の高靱性化(タフニング) 現象が見られた.破断面観察の結果は,pure W 以外で応力 除去処理材特有の扁平な結晶粒組織に由来する多層構造の 破面が観察されており,この温度および弾き出し量では格 子欠陥集合体形成による硬化は起こるものの,多層の微細 粒組織が残っているために,脆化が現れなかったものと考 えられる.今後はさらに低い温度での引張試験を行って, 照射材における延性と脆性の遷移の挙動を調べる予定である.

1050℃で照射した試料についても,照射後の引張試験を 行っており,データが出つつある.この温度で長期間の照 射を行った場合,試料によっては応力除去処理状態の組織 (微細な層状組織)が変質している可能性があり,計画して いる電子顕微鏡による微細組織の観察とあわせて,機械特 性評価を進める.

3.6 まとめ

熱中性子遮蔽を行った中性子照射試験により,比較的核 融合での条件に近い中性子スペクトルで,1000℃を超える 温度を含む温度条件における各種タングステン系材料の照 射効果に関する知見が得られた. 熱中性子遮蔽の無い Rabbit 照射では、ほとんどの試料に おいて核変換で形成されたレニウムと、形成されたレニウ ム付近にオスミウムが観察され、比較的大きな硬さの変化 が見られた.熱中性子遮蔽を行った RB*カプセル照射に おいて、550℃の照射では照射硬化は見られたものの、 W-3%ReとK-doped W-3%Reにおいては延性挙動が認めら れた.850℃の照射では、K-doped W とK-doped W-3%Re は照射前と同様の延びと延性挙動を示した.RB*カプセ ルでの550℃で照射した Pure W,K-doped W-3%Re とも に、熱拡散率の低下が確認された.室温では Pure W の方が K-doped W-3%Re に比べ50%以上高い値を示したが、照射 温度付近の高温では Pure W の低下が大きいため、差は 20%程度であった.

参考文献

- [1] K. Tsuchida et al., Nucl. Mater. Energy 15, 158 (2018).
- [2] M. Fukuda et al., Fusion Sci. Technol. 68, 690 (2015).
- [3] M. Fukuda et al., Fusion Eng. Des. 132, 1 (2018).
- [4] S. Nogami et al., Fusion Eng. Des. 140, 48 (2019).
- [5] Mohamed E. Sawan, Fusion Sci. Technol. 66, 272 (2014).
- [6] M. Akiyoshi et al., Fusion Eng. Des. 136 Part A, 513 (2018).
- [7] T. Miyazawa et al., J. Nucl. Mater. 529, 151910 (2020). https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2019.151910.